

ПРОГРАММА VII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ»

ОРГАНИЗАТОРЫ:

АО «ТЕСТПРИБОР»

совместно с Департаментом радиоэлектронной промышленности МИНПРОМТОРГ РФ,
при поддержке ФГУП «МНИИРИП» и АО «РКС»

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Дата проведения: 16-17 августа 2017 г.

Сбор и регистрация участников:

с 8⁰⁰ – 9³⁰ на причале Северного Речного Вокзала по адресу: г. Москва, станция метро «Речной Вокзал», Ленинградское шоссе, д. 51.

Время отправления теплохода «Анна Каренина» 09:55.

Место проведение конференции: Конференц-зал теплохода «Анна Каренина»

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

16 августа	10 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	Открытие конференции на теплоходе «Анна Каренина»
	13 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	Обед
	14 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰	Продолжение конференции
	17 ⁰⁰	Заселение в Оздоровительный комплекс «Клязьма» Управления делами Президента РФ
	19 ⁰⁰	Торжественный вечер, посвященный открытию конференции
17 августа	8 ⁰⁰ – 09 ³⁰	Завтрак (Оздоровительный комплекс «Клязьма» Управления делами Президента РФ)
	10 ⁰⁰ – 13 ⁵⁰	Продолжение конференции на теплоходе «Анна Каренина»
	13 ⁵⁰ – 14 ⁰⁰	Закрытие конференции. Прибытие в Москву (Северный речной вокзал)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

16 августа, четверг		
Тема доклада	Докладчик	Время
Открытие конференции	Александрова Светлана Валерьевна Генеральный директор АО «ТЕСТПРИБОР», г. Москва Куцько Павел Павлович Директор ФГУП «МНИИРИП», г. Мытищи	10⁰⁰ - 10¹⁵
1. Использование торгово-информационной площадки для обеспечения радиоэлектронной аппаратуры ЭКБ отечественного производства.	Куцько Павел Павлович Директор ФГУП «МНИИРИП», г. Мытищи	10¹⁵ - 10³⁰
2. Координационный совет и межхолдинговый информационный обмен.	Брыкин Арсений Валерьевич Директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника», корпорация «Ростех», г. Москва	10³⁰ - 10⁴⁵
3. Применение экранов локальной защиты для повышения радиационной стойкости изделий космической микроэлектроники.	Грабчиков Сергей Степанович Главный научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», г. Минск	10⁴⁵ - 11⁰⁰
4. Корпуса для производства микроэлектроники. Новая продукция и услуги, выполняемые производством АО «ТЕСТПРИБОР».	Максимов Алексей Ювиславович Начальник конструкторского бюро АО «ТЕСТПРИБОР», г. Москва	11⁰⁰ - 11¹⁵
5. Испытательный центр АО «ЭНПО СПЭЛС».	Калашников Олег Арсеньевич Заместитель генерального директора АО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва	11¹⁵ - 11³⁰
6. Долговременное хранение и консервация ЭКБ в АО «ТЕСТПРИБОР».	Гребенщиков Павел Игоревич Начальник ИЛ ЭКБ АО «ТЕСТПРИБОР», г. Москва	11³⁰ - 11⁴⁵
7. Зеленоградский нанотехнологический центр - перспективная инфраструктурная площадка для развития МЭМС-фаундри в рамках ОЭЗ «Зеленоград».	Корепанов Игорь Константинович Руководитель департамента продаж АО «Зеленоградский нанотехнологический центр», г. Зеленоград	11⁴⁵ - 12⁰⁰
8. Актуальные вопросы применения ЭКБ в РЭА КА в части стойкости к воздействию ионизирующих излучений космического пространства.	Чубунов Павел Александрович Начальник отдела Филиал АО «ОРКК»-«НИИ КП», г. Москва	12⁰⁰ - 12¹⁵
9. Рентгеновский контроль ЭКБ.	Сашов Александр Анатольевич Начальник отделения Кулибаба Андрей Ярославович Начальник отдела АО «РКС», г. Москва	12¹⁵ - 12³⁰
10. Обеспечение надежности отечественной ЭКБ.	Максимов Юрий Викторович Заместитель генерального директора АО «ИСС им. ак. М.Ф. Решетнева», г. Железнодорожск	12³⁰ - 12⁴⁵
11. Перспективные кремниевые планарные и 3D конденсаторы отечественного производства.	Громов Владимир Иванович Директор по развитию и новой технике ЗАО «Группа Кремний Эл», г. Брянск	12⁴⁵ - 13⁰⁰
Обед (1 час)		13⁰⁰ - 14⁰⁰

12. Порядок согласования программ и методик сертификационных испытаний. Требования к участникам.	Левин Роман Григорьевич Первый заместитель генерального директора АО «РНИИ «Электронстандарт», г. Санкт-Петербург	14 ⁰⁰ - 14 ¹⁵
13. Организация работ по программному развитию и применению ЭКБ в холдинговой компании АО «Росэлектроника».	Исаев Вячеслав Анатольевич Директор по научно-техническому развитию и инновациям АО «Росэлектроника», г. Москва	14 ¹⁵ - 14 ³⁰
14. Программа поставок СВЧ компонентов. Оборудование для испытаний СВЧ и РЭА.	Светлаков Александр Владимирович Технический специалист Скребнев Артемий Алексеевич Технический специалист АО «ТЕСТПРИБОР», г. Москва	14 ³⁰ - 14 ⁴⁵
15. Актуальные аспекты создания бортовой импортонезависимой аппаратуры.	Краснов Михаил Игоревич Начальник центра Стешенко Владимир Борисович Заместитель генерального конструктора по ЭКБ АО «РКС», г. Москва	14 ⁴⁵ - 15 ⁰⁰
16. Отечественная ЭКБ экстремальной электроники и фотоники. Карбид кремния, Алмаз.	Лучинин Виктор Викторович Д.т.н., проф., заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники, директор ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург	15 ⁰⁰ - 15 ¹⁵
17. Конформная ЭКБ для интернета вещей. Гибкая печатная электроника.	Бохов Олег Сергеевич К.т.н., старший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург	15 ¹⁵ - 15 ³⁰
18. Современные малоинвазивные методы анализа информационной безопасности микроконтроллеров и уязвимости защиты их памяти.	Гасников Алексей Олегович К.т.н., старший научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург	15 ³⁰ - 15 ⁴⁵
19. Технологические возможности и продуктовый портфель.	Шмаков Евгений Вячеславович Директор по продажам ПАО «Микрон», г. Зеленоград	15 ⁴⁵ - 16 ⁰⁰
20. Налоговая безопасность бизнеса.	Яхудин Руслан Сяитович Управляющий партнер ООО «Консалтинговая группа «ТАКО», г. Москва	16 ⁰⁰ - 16 ¹⁵
21. Круглый стол: Ответы на вопросы, обсуждение докладов.	Представители: ФГУП «МНИИРИП» АО «Росэлектроника» МО РФ (46 ЦНИИ МО РФ) Участники конференции.	16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰
<i>Высадка на причале, заселение в Оздоровительный комплекс «Клязьма» Управления делами Президента РФ, торжественный вечер, посвященный открытию конференции.</i>		

17 августа, пятница

Тема доклада	Докладчик	Время
22. Оружие войн будущего. Электроника.	Шпак Василий Викторович Генеральный директор АО «НИИМА «Прогресс», г. Москва	10 ⁰⁰ - 10 ¹⁵
23. Сертификация, как один из инструментов по обеспечению качества ЭКБ.	Егорова Мария Александровна Вице-президент АНО «Военный Регистр», руководитель органа по оценке компетентности, заместитель руководителя ЦО СДС «Военный Регистр» АНО «Военный Регистр», г. Москва	10 ¹⁵ - 10 ³⁰
24. Импортозамещение СВЧ-фильтров в ООО «Радиокомп».	Кувшинов Вадим Владимирович Начальник производственного отдела ООО «Радиокомп», г. Москва	10 ³⁰ - 10 ⁴⁵
25. Устройства формирования частот и сигналов для радиолокационных комплексов.	Кочемасов Виктор Неофидович Генеральный директор ООО «Радиокомп», г. Москва	10 ⁴⁵ - 11 ⁰⁰
26. Хранение ЭКБ в логистическом центре.	Тарасов Денис Русланович Начальник центра страховых запасов АО «НПП «Завод Искра», г. Ульяновск	11 ⁰⁰ - 11 ¹⁵
27. Вопросы организации и проведения испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ.	Козюков Александр Евгеньевич Начальник отдела Филиал АО «ОРКК»-«НИИ КП», г. Москва	11 ¹⁵ - 11 ³⁰
28. Источники вторичного электропитания с высокими значениями спецстойкости для применения в авиации и космонавтике.	Терез Александр Юрьевич Главный конструктор ЗАО «РЕОМ», г. Санкт-Петербург	11 ³⁰ - 11 ⁴⁵
29. Драйверы космической отрасли и актуальные вопросы тестирования электронных систем спутников.	Епифанов Виктор Борисович Руководитель направления ООО «Кейсайт Текнолоджиз», г. Москва	11 ⁴⁵ - 12 ⁰⁰
30. Разработка ЭКБ, стойкой к воздействию факторам космического пространства, на основе 65 нм КМОП технологии.	Горбунов Максим Сергеевич Заместитель директора по наноэлектронике ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, г. Москва	12 ⁰⁰ - 12 ¹⁵
31. Разработка и внедрение автоматизированных систем для тестирования ЭКБ.	Колочков Сергей Викторович Руководитель инженерного центра ООО ИЦ «АСК», г. Москва	12 ¹⁵ - 12 ³⁰
32. Участие Банка в исполнении контракта.	Сочинский Игорь Анатольевич Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами ПАО «РосДорБанк», г. Москва	12 ³⁰ - 12 ⁴⁵
<u>Заккрытие конференции. Прибытие в г. Москва (Северный Речной Вокзал)</u>		

Примечание: программа VII Всероссийской научно-технической конференции на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ» может корректироваться и дополняться. Организационный комитет оставляет за собой право корректировать время выступления докладчиков.